

Part 4 サンビーム成果発表一覧

2017年度下期～2018年度上期

発表形式

- 1 : 原著論文／博士論文／査読付きプロシーディングス
- 2 : 総説
- 3 : 査読なしプロシーディングス
- 4 : 単行本
- 5 : 賞
- 7 : その他の出版物
- 8 : 招待講演
- 9 : 口頭／ポスター発表(サンビーム研究発表会を含む)
- 10 : SPring-8 利用研究成果集
- 11 : 公開技術報告書
- 12 : プレス発表／取材(新聞、テレビ、雑誌等々マスコミ関係取材)

SB No. : サンビーム成果登録番号

JASRI No. : JASRI 研究成果番号



サンビーム成果発表一覧 発表形式 1, 10, 11

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目		筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]		
11	1044	35998	2016B5010, 2016B5311 2017A5010	浸炭歯車の残留応力測定技術の開発		今村 嘉秀
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.119-122 [2018/3]		川崎重工業(株)
11	1045	35999	2016B5310, 2017A5310	三元触媒の貴金属に及ぼす温度とガス雰囲気の影響		松田 千明
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.123-126 [2018/3]		川崎重工業(株)
11	1092	36527	2016B5320, 2017A5320	XAFS を用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響		横溝 臣智
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.114-118 [2018/3]		(株)コベルコ科研
11	1051	36344	2016A5030, 2016B5031 2017A5031	その場X線回折によるSiGe薄膜中ナノ結晶成長過程の観測		豊島 遼
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.110-113 [2018/3]		住友電気工業(株)
11	1052	35878	2015B5030, 2016A5031 2016B5030, 2017A5030	硬X線光電子分光を用いたCr/ポリイミド界面の化学状態解析		久保 優吾
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.104-109 [2018/3]		住友電気工業(株)
1	1061	36478	2014B1950, 2015A1999 2015B1942, 2015B1963 2017A5330	Structural analysis of sulfuric acid solutions containing Ti and Mn using x-ray diffraction, x-ray absorption fine structure, and molecular dynamics simulation		徳田 一弥
				The Journal of Chemical Physics 149,014503 (2018).		住友電気工業(株)
11	1062	36483	2015B5040, 2016A5040 2016B5040	黒鉛上負極電解液分解過程のHAXPES解析		西 寿朗
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.97-99 [2018/3]		ソニー(株)
11	1063	36484	2015B5340, 2016A5340 2016B5340	in-situ XAFS 自動解析プログラムの開発およびリチウムイオン二次電池正極活物質の解析への応用		稲葉 雄大
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.100-103 [2018/3]		ソニー(株)
11	1055	36370	2017A5351	リチウム二次電池正極材料の局所構造解析		橋上 聖
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.94-96 [2018/3]		関西電力(株)
11	1080	35783	2016A5350, 2016B5350 2017A5350	透過法XAFSを用いた石炭およびチャーに含まれる鉄の形態分析		池田 敦
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.90-93 [2018/3]		(一財)電力中央研究所
1	1065	36379	2016A5360	Large lithium storage in highly crystalline TiNb ₂ O ₇ nanoparticles synthesized by a hydrothermal method as anodes for lithium-ion batteries		伊勢 一樹
				Solid State Ionics, 320,p7-15 (2018)		(株)東芝
1	1066	36486	2017B5360	Giant voltage-controlled magnetic anisotropy effect in a crystallographically strained CoFe system		加藤 侑志
				Y. Kato et al., Appl. Phys. Express 11, 053007 (2018).		(株)東芝
11	1067	36528	2016A5360, 2016B5360	次世代磁気抵抗メモリ向けタングステン薄膜の局所構造解析		藤井 景子
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.87-89 [2018/3]		(株)東芝
11	1068	36530	2016A5060, 2016B5060 2017A5060	アモルファスシリコンの固相結晶化現象のその場観察		河井 友也
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.83-86 [2018/3]		(株)東芝
1	1140	37053	2016A5060, 2016B5060 2017A5060, 2017B5060	(Invited) High-Sn Concentration MOCVD-Grown Strained GeSn Thin Films Evaluated Using HAXPES and XRD Base on Synchrotron Technique		臼田 宏治
				ECS Transactions, 86,p411-418 (2018)		東芝メモリ(株)

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目		筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]		
1	1097	35701	2016B7032, 2017A7034 2016A5070, 2017A5070	Highly Enhanced Electrochemical Water Oxidation Reaction over Hyperfine β -FeOOH(Cl):Ni Nanorod Electrode by Modification with Amorphous Ni(OH) ₂	Bulletin of the Chemical Society of Japan 91巻 5号 p778-786 (2018)	鈴木 登美子 (株)豊田中央研究所
11	1106	35972	2014A5370, 2014B5371 2015A5371, 2015B5370 2016A5370, 2016B5370 2017A5370	GaN単結晶基板のX線トポグラフィおよびダイオード評価	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.80-82 [2018/3]	兼近 将一 (株)豊田中央研究所
11	1058	36450	2015B5080, 2016A5080 2016B5080	蛍光X線ホログラフィー法を用いたMQW (InGaN/GaN)の解析(1)	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.76-79 [2018/3]	川村 朋晃 日亜化学工業(株)
11	1059	36446	2016A5080, 2016B5080	サファイア層に埋もれた界面のX線回折測定	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.72-75 [2018/3]	宮野 宗彦 日亜化学工業(株)
1	1060	35331	2007B1738, 2008A1679 2008B1795, 2013A5080 2013B5080	Synchrotron radiation microbeam X-ray diffraction for nondestructive assessments of local structural properties of faceted InGaN/GaN quantum wells	Applied Physics Express Vol.11 No.3,p031001-1 - 031001-4 (2018)	榊 篤史 日亜化学工業(株)
1	1075	35211	2015B3388, 2016A1805 2016A5390, 2016B5390	Weakened CO adsorption and enhanced structural integrity of a stabilized Pt skin/PtCo hydrogen oxidation catalyst analysed by in situ X-ray absorption spectroscopy	RSC. Issue 24, 2017 Catalysis Science & Technology, 7,p6124-6131 (2017) DOI: 10.1039/C7CY01700F	Guoyu Shi 山梨大学 (株)日産アーク
11	1076	36343	2015B3388, 2016A1805 2016A5390, 2016B5390	燃料電池用新規アノード触媒のXAFSによるCO吸着解析	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.64-66 [2018/3]	矢野 啓 山梨大学 (株)日産アーク
11	1077	36341	2014B5091, 2015B5091 2015A5390, 2016A5091	Hard X-ray photoelectron spectroscopyを用いたLiイオン電池におけるSi系負極の表面分析	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.67-71 [2018/3]	高橋 伊久磨 日産自動車(株)
11	1056	36411	2016B5420, 2017A5420	La ₃ Si ₆ N ₁₁ :Ce ³⁺ 系蛍光体におけるCe ³⁺ 近傍局所構造の解析	Analysis on Local Structure Near Ce ³⁺ for La ₃ Si ₆ N ₁₁ :Ce ³⁺ Phospho	長尾 宣明 パナソニック(株)
11	1057	36412	2016B5120, 2017A5120 2016B5420, 2017A5420	リチウムイオン電池正極活物質における化学状態解析	Analysis on Chemical States of Cathode Material for Lithium Ion Battery	名嘉真 好政 パナソニック(株)
1	1118	37027	2017A5120, 2017B5120 2018A5120	Solid Halide Electrolytes with High Lithium-Ion Conductivity for Application in 4 V Class Bulk-Type All-Solid-State Batteries.	Adv. Mater. 2018, DOI: 10.1002/adma.201803075.	浅野 哲也 パナソニック(株)
11	1107	36998	2016B5100	X線反射率によるリチウムイオン電池電極/電解液界面のその場計測	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.46-49 [2018/3]	高松 大郊 (株)日立製作所
11	1108	36999	2016B5400	XAFSによるフルホイスラ合金 Fe ₂ (TiV)Si 薄膜の微細構造評価	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.50-53 [2018/3]	西出 聡悟 (株)日立製作所
11	1046	36338	2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410	強誘電体メモリ用PLZT薄膜の結晶化メカニズム	サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.41-45 [2018/3]	野村 健二 (株)富士通研究所

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
1	1079	36649	2017B5110, 2018A5110	Improvement of ferroelectric random access memory manufacturing margin by employing Pt/AlO _x bottom electrode for the La-doped Pb(Zr,Ti)O ₃ ferroelectric capacitor	野村 健二 (株)富士通研究所
				Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 11UF01	
1	1085	36843	2017B5110, 2018A5110	Development of highly reliable ferroelectric random access memory and its Internet of Things applications	恵下 隆 富士通セミコンダクター(株)
				Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 11UA01	
1	1115	37009	2017B5110, 2018A5110	Ag添加InSn合金における凝固過程の変化と組織への影響	上村 泰紀 (株)富士通研究所
				スマートプロセス学会誌 Vol.7,p154 (2018)	
1	1070	35434	2014B5130, 2015A5130 2015B5130	Correlation between electronic structure of SiN/AlGaN interface and gate leakage current	倉橋 健一郎 三菱電機(株)
				J. Soc. Elect. Mat. Eng. 26(1) pp.5-12 (2017)	
1	1071	35576	2012B5131, 2013A5131 2013A5430, 2013B5131 2014A5131	Structural Analysis in the Surface of Nitride Semiconductor by Grazing Incidence X-ray Diffraction	本谷 宗 三菱電機(株)
				Journal of Surface Analysis 24 (1) pp. 56 - 60 (2017)	
11	1072	35685	2016B5130	金属/AlGa _N 界面Schottky障壁の硬X線光電子分光評価	清井 明 三菱電機(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.7, 2017, p.29-31 [2018/3]	
11	1073	35732	2016B5430, 2017A5430	放射光X線トポグラフィによるSiCエピタキシャル層の評価	中村 勇 三菱電機(株)
				サンビーム年報・成果集 Vol.6, 2016, p.132-134 [2017/3]	

サンビーム成果発表一覧 発表形式 2~9, 12

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	1042	35880	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	酸化物層の成長抑制による遮熱コーティングの長寿命化	根上 将大
				日本材料学会腐食防食部門委員会 第320回例会 [2018/01/24]	川崎重工業(株)
9	1043	35908	2015A5010, 2015B5010 2016A5010	酸化物層の成長制御による遮熱コーティングの長寿命化	根上 将大
				日本溶射学会関東支部 平成29年度第3回支部講演会 [2018/03/20]	川崎重工業(株)
9	1083	36839	2017B5310, 2018A5311	XAFSによるアルカリ水電解用電極の表面解析	大石 彩加
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-01 [2018/9/6-9/7]	川崎重工業(株)
9	1084	36840	2016B5010, 2016B5311 2017A5010	浸炭層の残留応力分布評価	今村 嘉秀
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-02 [2018/9/6-9/7]	川崎重工業(株)
9	1088	36778	2017A5020, 2017B5020 2018A5020	HAXPESによる金属-樹脂界面の劣化挙動分析	山本 慎太郎
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-03 [2018/9/6-9/7]	(株)神戸製鋼所
9	1089	36780	2017A5020, 2017B5020 2018A5020	鋼板上酸化膜の高温その場残留応力測定	北原 周
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-04 [2018/9/6-9/7]	(株)コベルコ科研
9	1090	36875	2017A5320, 2017B5320 2018A5320	XAFSを用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響評価(2)	横溝 臣智
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-05 [2018/9/6-9/7]	(株)コベルコ科研
5	1091	34774	2015A5020, 2015B5020 2016A5020, 2016B5020	HAXPESを用いたAl合金表面の改質と変質挙動の評価	北原 周
				第17回サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) S-22 [2017/8/31-9/1] ※ポスター賞	(株)コベルコ科研
5	1050	36351	2015B5030, 2015B1870 2016A5031, 2016B5030	硬X線光電子分光による金属/高分子界面の密着機構の調査	久保 優吾
				第17回 サンビーム研究発表会(第14回SPring-8産業利用報告会) 優秀発表賞 [2017/8/31-9/1]	住友電気工業(株)
9	1053	36348	2016B1663, 2016B1845 2017A1638, 2016B5030 2017A5030	硬X線光電子分光を用いた金属/ポリイミド界面の密着機構の探究	久保 優吾
				第53回X線分析討論会 [2017.10.26-2017.10.28]	住友電気工業(株)
9	1054	36347	2017A5330, 2014B1950 2015A1999, 2015B1942 2015B1963	X線散乱と分子動力学シミュレーションによる硫酸系水溶液の構造解析	斎藤 吉広
				平成29年度液体・非晶質研究会 (2018.03.01)	住友電気工業(株)
9	1126	36997	2017B5330	銅合金の加工と熱処理に伴う添加元素状態変化のX線吸収分光による解析	後藤 和宏
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-06 [2018/9/6-9/7]	住友電気工業(株)
9	1127	37002	2017A5330, 2015B1963	レドックスフロー電池の電解液中の金属イオン状態の解析	徳田 一弥
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-07 [2018/9/6-9/7]	住友電気工業(株)
9	1116	37012	2017A5340, 2017B5340 2018A53400	X線吸収分光法によるGaInN活性層の配位数精密解析法の検討	稲葉 雄大
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-08 [2018/9/6-9/7]	ソニー(株)
9	1096	36983	2017B5050, 2018A5050	Enhanced Cyclic Performance of High-Ni LiNi _x Co _y Mn _(1-x-y) O ₂ by Lithium Boron Oxide Glass Coating at High Voltage	橋上 聖
				Americas International Meeting on Electrochemistry and Solid State Science 2018 (2018/9/30-10/4, Mexico)	関西電力(株)
9	1132	37062	2017B5050	ハイニッケル正極材料の化学結合状態分析	橋上 聖
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-09 [2018/9/6-9/7]	関西電力(株)

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	1081	35784	2017A5350	Relationship between Gasification Reactivity and Characteristics of Coal Char Prepared at Different Pyrolysis Temperatures	池田 敦 (一財)電力中央研究所
				2017 International Conference on Coal Science & Technology and 2017 Australia-China Symposium on Energy [2017.09.26-09.28] Beijing, China	
9	1082	35785	2017A5350	熱分解温度がチャーのガス化反応性および性状に与える影響の炭種間比較	池田 敦 (一財)電力中央研究所
				第54回 石炭学会議 [2017.10.18-10.19] Akita, Japan	
9	1124	37013	2017A5350	Study on the dominant factors of catalysis of inherent iron in coal for char gasification	池田 敦 (一財)電力中央研究所
				9th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies [2018.06.03-06.08] Berlin, Germany	
9	1125	37014	2016A5350, 2016B5350 2017A5350, 2017B5350	石炭チャーに含まれる鉄の化学形態に対する熱分解温度の影響	池田 敦 (一財)電力中央研究所
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-10 [2018/9/6-9/7]	
9	1064	34708	2016A5360	Large Lithium Storage of Hydrothermally Synthesized TiNb2O7 Particles	伊勢 一樹 (株)東芝
				232nd ECS MEETING [2017.10.01-10.05]	
9	1069	36531	2017A5060, 2017B5060	Voltage-control spintronics memory (VoCSM) with Low Write Current Using Highly Selective Patterning Process	清水 真理子 (株)東芝
				Digests of ICUMS 2018 [2018.6.03-6.07]	
9	1133	37052	2016A5060, 2016B5060 2017A5060, 2017B5060	Sb添加高Sn濃度MOCVD-GeSn薄膜の硬X線光電子分光法(HAXPES)による化学結合状態解析	臼田 宏治 東芝メモリ(株)
				電子デバイス界面テクノロジー研究会(第23回) [2018.1.18-1.20]	
9	1134	37046		サンビーム(BL16XU・BL16B2)の現状	吉木 昌彦 (株)東芝
				SPring-8シンポジウム2018 [2018.8.25-8.26]	
9	1135	37048		サンビーム(BL16XU・BL16B2)の現状	吉木 昌彦 (株)東芝
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-29 [2018/9/6-9/7]	
9	1136	37059	2017A5360, 2017B5360	リチウムイオン電池用新規負極材料のXAFS解析	沖 充浩 (株)東芝
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-11 [2018/9/6-9/7]	
9	1137	37040	2017B5060	次世代メモリ向け試料の電圧印加HAXPES測定	藤井 景子 (株)東芝
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-12 [2018/9/6-9/7]	
9	1138	37041	2015B5060, 2016A5060 2016B5060, 2017A5060	硬X線光電子分光法(HAXPES)による強誘電体HfSiOキャパシタ構造積層膜の化学結合状態解析	臼田 宏治 東芝メモリ(株)
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-13 [2018/9/6-9/7]	
9	1139	37056	2016B5060, 2017A5060 2017B5060, 2018A5060	硬X線光電子分光法(HAXPES)による強誘電体HfSiO MIM構造積層膜の化学結合状態解析	臼田 宏治 東芝メモリ(株)
				秋季 応用物理学会学術講演会 [2018.9.18-9.21]	
8	1098	36745	2016A5071, 2017A5071 2017B5071	放射光を用いた表面分析によるトライボ現象解析	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				第50回 表面分析研究会講演会 [2018.02.26-02.27]	
8	1099	36757	2016A5071, 2017A5071 2017B5071	共同研究が導いたタブーへの挑戦	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				第2回 ISYSE研究会 [2018.09.16-09.17]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	1100	35503	2011B5370, 2012A5370 2013B5370, 2014A5370 2014B5371, 2015A5371 2015B5370	X線トポグラフィ用原子核乾板の開発	長縄 直崇 名古屋大学 (株)豊田中央研究所
				画像関連学会連合会 第4回秋季大会 写真学会 [2017.11.30-12.02]	
9	1101	36655	2016B5071, 2017A5071	オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜形成過程の解析	川浦 宏之 (株)豊田中央研究所
				2017年度 量子ビームサイエンスフェスタ [2018.03.02-03.04]	
9	1102	36656	2016B5071, 2017A5071	オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜形成過程の解析	川浦 宏之 (株)豊田中央研究所
				J-PARC MLF産業利用報告会 [2018.07.23-07.24]	
9	1103	36744	2016A5071, 2017A5071 2017B5071	Operando NEXAFSによる摩擦面の分析	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				X線分析討論会 [2017.10.26-10.27]	
9	1104	36654	2016B5071, 2017A5071	オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜形成過程の解析	川浦 宏之 (株)豊田中央研究所
				第58回 電池討論会 [2017.11.14-11.16]	
9	1105	36746	2016A5071, 2017A5071 2017B5071	EV用駆動系潤滑油による摩擦生成物の放射光分析	高橋 直子 (株)豊田中央研究所
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-14 [2018/9/6-9/7]	
9	1093	36893	2017A5380, 2017B5380	XAFSによる照明用LED蛍光体の劣化評価	榊 篤史 日垂化学工業(株)
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-17 [2018/9/6-9/7]	
9	1094	36894	2017A5080, 2017B5080	X線回折による照明用LED実装時の応力評価	宮野 宗彦 日垂化学工業(株)
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-16 [2018/9/6-9/7]	
8	1078	35859	2016A5390, 2016B3273 2017B1625, 他	量子ビームを用いた材料構造解析	伊藤 孝憲 (株)日産アーク
				愛知県「基盤産業支援セミナー」招待講演 開催日 2017.12.05 開催都市 名古屋	
8	1128	37044	2016A5390, 2016B3273 2017B1625, 他	先端電池開発における放射光粉末結晶解析の威力	伊藤 孝憲 (株)日産アーク
				日本化学会 第98春季年会 招待講演 開催日2018.3.20開催都市 船橋	
8	1129	37045	2016A5390, 2016B3273 2017B1625, 他	産業界における中性子, 放射光の相補的利用	伊藤 孝憲 (株)日産アーク
				第1回(国研)産総研 量子ビーム計測クラブ研究会招待講演 開催日2018.7.27開催都市 つくば	
8	1130	37042	2017B3381, 2018A5390	In situ XAFSによるPd系触媒のギ酸反応メカニズム解析	松本 匡史 (株)日産アーク
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-18 [2018/9/6-9/7]	
9	1131	37043	2014B5094, 2015A5391 2015B5391	放射光を用いた高エネルギーバッテリー正極材料の劣化メカニズム解析	高橋 伊久磨 日産自動車(株)
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-19 [2018/9/6-9/7]	
9	1095	36979	2015A5420, 2018A5420	Disordered Rocksalt Type Li-Rich Manganese Oxyfluoride as High-Capacity Cathode Material for Rechargeable Lithium Ion Batteries	夏井 竜一 パナソニック(株)
				AiMES 2018(Americans International Meeting on Electrochemistry and Solid State Science 2018)	
9	1117	37023	2017A5120, 2017B5120 2018A5120	Highly Ion-Conducting New Lithium Halide Solid Electrolytes for Bulk-Type All-Solid-State Batteries,	浅野 哲也 パナソニック(株)
				233rd ECS Meeting, Seattle, WA, U. S. A., May 13-17, 2018.	
9	1120	37028	2016B5420, 2017A5420	La3Si6N11:Ce3+系蛍光体におけるCe3+近傍局所構造の解析	長尾 宣明 パナソニック(株)
				第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-20 [2018/9/6-9/7]	

発表形式	SB No.	JASRI No.	実験課題番号	題目	筆頭者氏名 会社名
				発表先 [日付]	
9	1109	37005	2016B5400, 2017A5400 2017B5400, 2018A5400	オペランドトポグラフィーを用いたSiC MOSFETの積層欠陥の動的な観察 第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-22 [2018/9/6-9/7]	米山 明男 (株)日立製作所
9	1110	37006	2017A5100, 2017B5100	散漫散乱を用いたフォノン評価の検討 第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-21 [2018/9/6-9/7]	南部 英 (株)日立製作所
9	1111	37007	2016B5400, 2017A5400 2017B5400, 2018A5400	Operando X-ray topography of 4H-SiC MOSFETs to investigate stacking fault expansion 12th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, Birmingham, UK	小西 くみこ (株)日立製作所
9	1047	36339	2017B5110, 2018A5110	Effect of Pt/AlOx bottom electrode on the manufacturing process margin improvement of La-doped Pb(Zr,Ti)O3 thin films ISAF-FMA-AMF-AMEC-PFM Joint Conference [2018.05.27-06.01]	野村 健二 (株)富士通研究所
9	1048	36340	2017B5110	AlOx,TiOx,PtOxバツファ層のPbLa(Zr,Ti)O3薄膜結晶性への影響 応用物理学学会学術講演会 [2018.03.17-03.20]	王 文生 富士通セミコンダクター(株)
7	1049	36342	2016A5110, 2016A5410 2016B5110, 2016B5410	IoT市場向け強誘電体メモリにおけるPLZT薄膜の結晶化メカニズム SPring-8/SACLA利用者情報 23 (2018) 2	野村 健二 (株)富士通研究所
9	1086	36844	2018A5110	IrOx/PLZT/Pt強誘電体キャパシタにおける熱処理及びIrOx酸化度の最適化による分極特性向上と結晶化メカニズム解析 応用物理学学会学術講演会 [2018.09.18-09.21]	野村 健二 (株)富士通研究所
9	1087	36845	2017B5110, 2018A5110	強誘電体メモリの下部電極改良による量産性向上とメカニズム解明 第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-23 [2018/9/6-9/7]	野村 健二 (株)富士通研究所
9	1074	36634	2016B5131, 2017A5131	Surface dependences of the physical properties of amorphous aluminum oxide thin film formed by atomic layer deposition The 19th International Conference on Metalorganic Vapor Phase Epitaxy[2018/06]	本谷 宗 三菱電機(株)
9	1112	36689	2017B5130, 2018A5130	電圧印加硬X線光電子分光法によるMOS界面準位評価 第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-25 [2018/9/6-9/7]	清井 明 三菱電機(株)
9	1113	36694	2017B5430, 2018A5430	長寿命高誘電率Ta2O5膜の開発 第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-26 [2018/9/6-9/7]	今澤 貴史 三菱電機(株)
9	1114	36734		BL16B2の放射光イメージング機器整備 第18回サンビーム研究発表会(第15回SPring-8産業利用報告会) S-27 [2018/9/6-9/7]	本谷 宗 三菱電機(株)

編集後記

平成最後の「サンビーム年報・成果集」となる Vol.8 を発刊いたしました。本誌はサンビームで実施される成果非専有課題の「成果公開の媒体」として公開技術報告書の認定を受けており、それにふさわしい内容とするべく、とりまとめを担当いただいた共同体各社メンバーの方々、そして清水様をはじめ編集委員の皆様にご多大なご尽力をいただきました。この場をかりて心から感謝いたします。

Part 1 の活動トピックスでも紹介した通り、サンビーム共同体は 2018 年 4 月に専用ビームライン設置契約を更新し、第Ⅲ期の利用をスタートしました。第Ⅲ期の目標は、放射光を活用して研究から生産に至るまでの様々な課題を解決し、各社の事業、さらにはゆとりある豊かな社会の実現に貢献することです。しかし同時に、それらの成果を査読論文、また価値を成果専有利用という形で、これまで以上に広く世の中に示すことが求められており、共同体としても様々な施策を進めています。今後は各分野の論文誌や SPring-8 利用研究成果集での成果公開が増え、本誌の役割や体裁も変化していくかもしれませんが、サンビーム共同体の「成果発信の媒体」として、その在り方を検討していきたいと考えています。ご一読いただき、忌憚のないご意見、ご鞭撻を賜ればたいへん幸いです。

サンビーム共同体 2018 年度合同部会長・編集委員長
株式会社東芝 吉木 昌彦

サンビーム年報・成果集 Vol.8 2018

2019年3月発行

発行 産業用専用ビームライン建設利用共同体

編集 サンビーム共同体編集委員会

編集委員長	吉木 昌彦	(株)東芝
副編集委員長	山口 浩司	住友電気工業(株)
	清水 紀智	パナソニック(株)
編集委員	黒岡 和巳	パナソニック(株)
	小森 和彦	サンビーム共同体事務局

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1丁目 1-1

公益財団法人高輝度光科学研究センター内

産業用専用ビームライン建設利用共同体事務局

TEL : 0791-58-1839 FAX : 0791-58-1830

URL : <https://sunbeam.spring8.or.jp>

印刷 (株)佐藤印刷所

著作権法に基づき、本書のいかなる形式の複製または転載も、
当該箇所の著作者による事前の許可が必要です。



産業用専用ビームライン建設利用共同体

SUNBEAM Consortium